

校正証明書

試験実施日 2025 年 7 月 10 日 (木) 室温 26.1 °C 湿度 53 %

名称	ミリオームハイテスタ	形式	3220
製造者	HIOKI	製造番号	0637130
製造年月	1997年	-	-
定格	20mΩ ～20kΩ		

依頼者	セキデンエンジニアリング株式会社				
住所	東京都江戸川区北葛西2-29-15				
校正項目	電流、電圧				
校正方法	日本の公的校正機関(JEMIC、JQA、JCSS等)またはNIST等、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に対してトレーサビリティが保たれた標準器との比較により行う。				
校正室の環境条件	JEMIS 017(日本電気計測器工業会規格)：温湿度管理 クラスC級を参考とし 温度23±5℃ 湿度35%～75% とする。				
	環境標準器	名称	型式	製造番号	校正有効期限
		温湿度計	A-230-W	23A060	2028年3月
校正実施場所	茨城県つくば市臼井1954-1 つくば電気管理事務所 試験室				
付記	指示値は校正対象機器の示す値、標準値は入力した値または標準計器が示す値とする。				

上記の測定器は当社の校正機器によって校正され、
校正作業における検査または試験の結果は
仕様を満足しています。

この校正に使用した校正機器は、国家標準或いは
国際標準へのトレーサビリティがとれていることを
証明します。

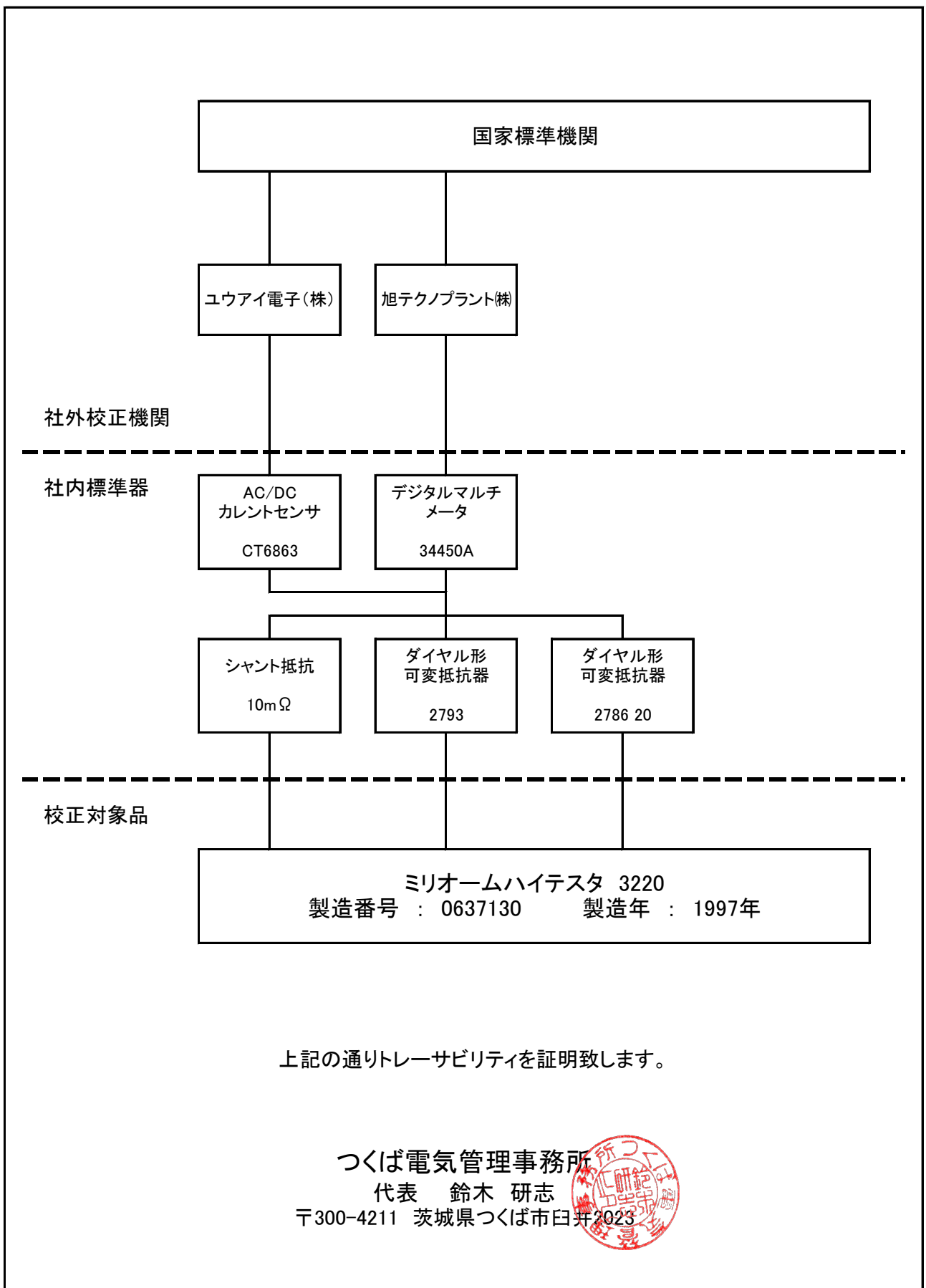
つくば電気管理事務所
代表 鈴木 研志
〒300-4211 茨城県つくば市臼井2023



トレーサビリティ体系図

試験実施日 2025 年 7 月 10 日 (木)

室温 26.1 °C 湿度 53 %



校正試験成績書

試験実施日 2025 年 7 月 10 日 (木)

室温 26.1 °C 湿度 53 %

試験実施者 鈴木 研志

名称	ミリオームハイテスタ	形式	3220
製造者	HIOKI	製造番号	0637130
製造年月	1997年	-	-
定格	20mΩ ~ 20kΩ		

1. 抵抗

レンジ		指示値		基準範囲(最小値)		基準範囲(最大値)		標準値		判定(良/不良)
20	mΩ	10	mΩ	9.94	mΩ	10.06	mΩ	10.02	mΩ	良
200	mΩ	100	mΩ	99.4	mΩ	100.6	mΩ	100.2	mΩ	良
2	Ω	1	Ω	0.994	Ω	1.006	Ω	0.994	Ω	良
20	Ω	10	Ω	9.94	Ω	10.06	Ω	9.95	Ω	良
200	Ω	100	Ω	99.4	Ω	100.6	Ω	99.8	Ω	良
2	kΩ	1	kΩ	0.994	kΩ	1.006	kΩ	0.996	kΩ	良
20	kΩ	10	kΩ	9.94	kΩ	10.06	kΩ	9.96	kΩ	良

確度: ±0.2%rdg. ±4dgt

2. 動作、各機能検査

検査項目	判定(良/不良)	備考
機能点検	良	
外観	良	

3. 校正使用機器

名称	型式	製造番号	有効期限
シャント抵抗	100mV,10A	10mΩ-2023	2026年3月
ダイヤル形可変抵抗器(0.001~1111.11Ω)	2793	61VX0075	2026年3月
ダイヤル形可変抵抗器(1Ω~111,111Ω)	2786 20	00122U	2026年3月

つくば電気管理事務所



ミリオームハイテスタ 3220